



人们所知道的几百种粒子中，绝大多数都是不稳定的。例如  $\pi^-$ （或  $\pi^+$ ）介子要衰变成一个  $\mu^-$ （或  $\mu^+$ ）和一个反中微子（或中微子）， $\mu^-$  要衰变成一个电子、一个中微子和一个反中微子。每一个粒子，从产生到衰变的一段时间就是它的寿命。单个  $\pi^-$  介子的寿命是有长有短的，单个  $\mu$  子的寿命也是有长有短的。但是如果有很多个  $\pi^\pm$  介子，它们就有一个平均寿命；如果有多个  $\mu$  子，它们也有一个平均寿命。每一种粒子的平均寿命都是一定的。例如  $\pi^\pm$  介子的平均寿命大致是  $2.6 \times 10^{-8}$  秒， $\mu$  子的平均寿命大致是  $2.2 \times 10^{-6}$  秒。粒子的平均寿命的长短与造成衰变的原因有关。 $\pi^\pm$  和  $\mu^\pm$  的衰变都是弱作用衰变。如果是电磁作用衰变，寿命就更短，例如  $\pi^0$ （电磁作用衰变）的寿命是  $0.84 \times 10^{-16}$  秒。强作用衰变的寿命更是短了，例如  $\rho$  介子（强作用衰变）的寿命是  $\sim 10^{-23}$  秒。

必须说明一点。刚才说的平均寿命是粒子静止时的平均寿命。如果粒子有速度，而且速度很大，能量很高，那末，由于相对论效应，它表现出来的寿命也是会增加的。仍举  $\pi$  介子为例，低能量的  $\pi$  介子在衰变之前走不了几米远。但如果  $\pi$  介子的能量是 14 亿电子伏，它从产生到衰变就平均可走七十多米，如果能量是 140 亿电子伏，平均可走七百多米。这都是相对论寿命延长效应的表现。

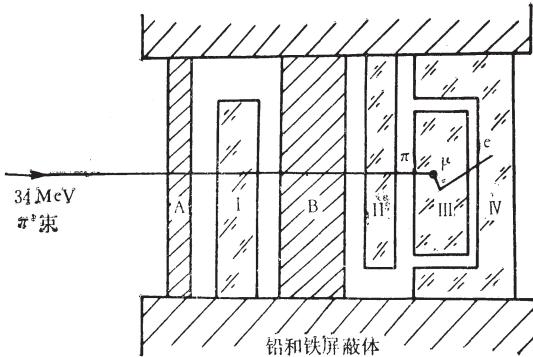


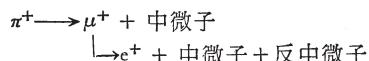
图 1 测量  $\pi^+$  寿命实验安排示意图

I、II、III、IV 是闪烁计数器，A、B 是吸收体。

由于各种粒子的平均寿命相差很大，所以测量平

均寿命的方法也不一样。

1. 对于寿命长于  $10^{-9}$  秒的粒子，可用计数器电子学的办法，图 1 是测量  $\pi^+$  介子寿命的计数器实验示意图。这个装置探测的是如下的过程：



（中微子，反中微子不带电，实际上探测的是  $\pi^+ \mu^+$  和  $e^+$ ）

当 3,400 万电子伏的低能  $\pi^+$  介子进入这个系统时，由于 A、B 吸收体的作用，使  $\pi^+$  损失掉它的大部分动能， $\pi^+$  穿过计数器 I、II，最后停止在 III 中。所以 I、II、III 有计数，而 IV 没有。给出的讯号是：

$$I + II + III + \overline{IV}$$

(IV 上有一划，表示闪烁计数器 IV 没有计数，下同)

停止在闪烁体 III 中的  $\pi^+$  经过一段时间后就要衰变，有更低能量的 410 万电子伏的  $\mu$  子由  $\pi^+$  衰变出来。因为  $\mu$  的能量很小，它跑不出计数器 III。所以只有计数器 III 有计数，而 II 和 IV 都没有计数，讯号是：

$$III + \overline{II} + \overline{IV}$$

在计数器 III 中的  $\mu^+$ ，经过一段时间后又衰变，有阳电子  $e^+$  由  $\mu^+$  衰变出来，平均能量大约 5000 万电子伏。它可以从计数器 III 中逃出，或者被计数器 II 又计录，或者被 IV 又计录，阳电子的讯号是：

$$III + II + IV \text{ 或 } III + \overline{II} + IV$$

这样就可用电子线路把  $\pi^+$ 、 $\mu^+$ 、 $e^+$  的讯号区分开来。测量  $\pi^+$  和  $\mu^+$  讯号之间的时间间隔可以得到各个  $\pi^+$  介子在 III 中的生存时间，根据这些生存时间，就可以算出  $\pi^+$  的寿命。最新的  $\pi^+$  平均寿命的测量数据为：

$$(2.6024 \pm 0.0024) \times 10^{-8} / \text{秒}$$

2. 寿命长于  $10^{-17}$  秒，短于  $10^{-9}$  秒的粒子用测距的方法。因为在这种短寿命的情况下衰变长度太短，无法安排计数器来测量寿命。而火花室，气泡室，乳胶等径迹探测器是可以观察到这一长度的。

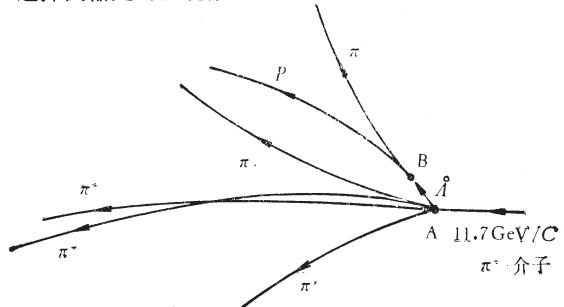


图 2 气泡室照片示意图  
在相互作用中产生  $\Lambda$ 。 $\Lambda$  在衰变成 P 和  $\pi^-$   
之前穿过几厘米的距离。

图(2)就在一个2米气泡室中拍摄的一张 $\dot{\Lambda}$ 衰变为P和 $\pi^-$ 的照片示意图。图片中有一对带电粒子形成V型径迹。一个是质子，另一是 $\pi^-$ 。它们是由 $\dot{\Lambda}$ 衰变出来的。因为 $\dot{\Lambda}$ 不带电，在照片中看不到它的径迹，但是产生 $\dot{\Lambda}$ 的A点和 $\dot{\Lambda}$ 衰变成P和 $\pi^-$ 的B点是很清楚的。A, B两点的距离就是 $\dot{\Lambda}$ 的衰变长度。测量这个长度就可以得到 $\dot{\Lambda}$ 的寿命。这就是所谓的“测距”法。

在气泡室灯光拍摄时又加上一个强磁场，在磁场作用下，带电的P和 $\pi^-$ 的径迹都变弯曲了，通过测量径迹的曲率就可得到它们的动量。 $\dot{\Lambda}$ 的动量就是P和 $\pi^-$ 动量之和。当 $\dot{\Lambda}$ 的质量已知，根据它们的动量和衰变距离就可算出 $\dot{\Lambda}$ 静止时的平均寿命。

为了得到精确的数值，需要观测几千个这种衰变事例。而为了得到几千个这种事例，就需要分析大约几万张照片。不过现在有自动测量装置，分析这样多的片子也是不难的。用这种方法得到 $\dot{\Lambda}$ 的寿命是：

$$(2.521 \pm 0.021) \times 10^{-10} \text{ 秒}$$

3. 寿命短于 $10^{-17}$ 秒的粒子无法直接测量寿命，而是测量粒子质量的自然宽度（例如散射截面能量曲线的共振宽度）。根据宽度可以推算寿命。实际上对于这种短寿命粒子很少说它的寿命，只讲它的宽度，例如 $\rho$ 介子的宽度是 $146 \pm 10$ 兆电子伏。